	วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00	
	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	••	1 กุมภาพันธ์ 2565	
RIC KKU	WI-RIC-OP02-34	หน้า	:	หน้า 1 จาก 13	
ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)					



# วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ:		
นายอกนิษฐ์ สันธินาศ นักวิชาการวิทยาศาสต	ร์	
ผู้ทบทวน:	ผู้อนุมัติ:	:
นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ รักษาการผู้จัดการ ศูนย์เครื่องมือวิจัย	ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	ศาสตราจารย์ มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

	วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00	
	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	••	1 กุมภาพันธ์ 2565	
RIC KKU	WI-RIC-OP02-34	หน้า	••	หน้า 2 จาก 13	
ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)					

		บันทึกการแก้ไข
วันที่	ฉบับแก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข
1 กุมภาพันธ์ 2565	00	เริ่มประยุกต์ใช้

	วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00	
	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	:	1 กุมภาพันธ์ 2565	
RIC KKU	WI-RIC-OP02-34	หน้า	:	หน้า 3 จาก 13	
ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)					

#### 1. วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

- 1.1 เพื่อเป็นมาตรฐานวิธีปฏิบัติในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) ให้ถูกต้อง เหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือหรืออันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
- 1.2 เพื่อเป็นมาตรฐานวิธีปฏิบัติในการบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) เพื่อให้ เครื่องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน การตรวจทดสอบตัวอย่างมีคุณภาพ และเครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ ยาวนาน

#### 2. ขอบเขต (SCOPE)

วิธีปฏิบัติงานนี้ใช้สำหรับการให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) แบบส่องกราดรุ่น Tescan MIRA ของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ได้แก่ การเปิด-ปิด การปรับโฟกัสภาพ การวิเคราะห์ธาตุด้วย X-ray Diffractor การประมวลผลและพิมพ์ผลการทดสอบ ตัวอย่าง และการดูแลรักษาเครื่องมือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

### 3. เอกสารอ้างอิง (REFERENCE DOCUMENTS)

- 3.1 เอกสารระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และสอบเทียบเครื่องมือวิจัย (QP-RIC-OP-01)
  3.2 เอกสารระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การให้บริการเครื่องมือ ทดสอบตัวอย่างตัวอย่าง และรายงานผล (QP-RIC-OP-02)
- 3.3 เอกสารสนับสนุนกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) (SD-RIC-OP-01-34)

# 4. คำจำกัดความ (DEFINITIONS)

 4.1 ตัวอย่าง คือ ชิ้นงานที่จะนำมาตรวจสอบซึ่งต้องมีลักษณะทางกายภาพที่มั่นคงแข็งแรงไม่หลุดออกระหว่างการ ทดสอบ หากตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้าหรือนำไฟฟ้าได้ไม่ดีต้องทำการฉาบผิวด้วยทองก่อนนำตัวอย่างเข้า Chamber เพื่อทดสอบ และต้องแห้งสนิท

4.2 ผลการวิเคราะห์ คือ ข้อมูลจากการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ได้แก่ ภาพถ่ายใน โหมด Secondary Electron, Backscattered Electron และข้อมูลการวิเคราะห์ธาตุในโหมดEnergy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) ประกอบไปด้วย กราฟแสดง peak ของธาตุที่พบ ข้อมูลแสดงเปอร์เซ็นต์ของธาตุที่ พบโดยน้ำหนักและโดยอะตอม

	วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00	
	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	:	1 กุมภาพันธ์ 2565	
RIC KKU	WI-RIC-OP02-34	หน้า	••	หน้า 4 จาก 13	
ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)					

#### 5. สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการควรอยู่ในสภาพที่แห้ง อุณหภูมิไม่เกิน 25±2 °C ความชื้นต้องไม่เกิน 70 %RH มีการบันทึกข้อมูล สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ บันทึกการควบคุมสภาพแวดล้อมประจำห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอใน FM-RIC-OP02-01 บันทึกการควบคุมสภาพแวดล้อม-FESEM อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการใช้งาน

# 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE)

- 6.1. ขั้นตอนการเปิด
  - 6.1.1 เปิดไนโตรเจนที่ถังไนโตรเจน
  - 6.1.2 กดปุ่ม Sleep ที่โปรแกรม Tescan Essence 6.1.3 รอให้ปั้มทำงานจะมีไฟสีเขียวสว่างกระพริบที่ Highvac

6.1.4 เมื่อไฟสีเขียวหยุดกระพริบจากนั้นคลิ๊กที่เครื่องหมายถูกด้านข้างหากขึ้นว่า "Everythings is OK" จึง สามารถใช้งานได้ กรณีขึ้นแจ้งเตือนสีแดงให้เปิดดูว่าเกิดปัญหาใด จากนั้นเปิดหาวิธีแก้ใน เอกสาร 0.SD-RIC-OP02-34



	วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00	
	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	••	1 กุมภาพันธ์ 2565	
RIC KKU	WI-RIC-OP02-34	หน้า	:	หน้า 5 จาก 13	
ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)					

			( Petropological Contraction of the second s	Detector drifts	Sharksem	Advanced
		<b>6</b> 11	1		1.1	
11-06 08:15:3	9 Some	software modules	do not have va	alid license! - Open licer	nce manager by dou	ble click

- 6.2. ขั้นตอนการเตรียมและใส่ตัวอย่าง
  - 6.2.1 การเตรียมตัวอย่าง
    - a) กรณีตัวอย่างที่นำไฟฟ้า ให้ติดตัวอย่างกับคาร์บอนเทป หรือ อัลลูมิเนียมเทป กับ Stub หรือ หากตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ให้ทำการติดกับ Stage โดยไม่ต้องใช้ Stub ให้เทปเป็นตัวกลาง ระหว่างตัวอย่างและ Stage หรือ Stub
    - b) กรณีตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้าให้ติดตัวอย่างกับคาร์บอนเทป หรือ อัลลูมิเนียมเทป กับ Stub หรือหากตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ให้ทำการติดกับ Stage โดยไม่ต้องใช้ Stub ให้เทปเป็น ตัวกลางระหว่างตัวอย่างและ Stage หรือ Stub

6.2.2 นำตัวอย่างที่เตรียมไว่ใส่ใน chamber โดยคลิ๊กที่ปุ่ม Vent และรอปั้มทำงานจนกว่าสัญลักษณ์ Vent จะเปลี่ยนเป็น Pump



	วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00	
	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	:	1 กุมภาพันธ์ 2565	
RIC KKU	WI-RIC-OP02-34	หน้า	:	หน้า 6 จาก 13	
ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)					

6.2.3 ถอดฝา Chamber ออกจากนั้นใส่ตัวอย่างที่ Stage ขันน็อตยึดให้แน่นและปิด Chamber และสวมถุง มือทุกในการใส่ตัวอย่าง





6.2.4 คลิ๊กที่ปุ่ม Pump ใช้มือดันฝา chamber ไว้เบาๆ ประมาณ 10 วินาที จึงนำออกมือออกและรอจนกว่า ไฟกระพริบที่ HighVac หยุดนิ่ง



6.2.5 เปิด Beam โดยคลิ๊กที่ปุ่ม Beam ใส่พลังงานที่ต้องการจากนั้นกด Enter จากนั้นประมาณ 1 นาที และ กด Beam current โดยเลือกที่ Set Best beam current



	วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00	
RIC KKU	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	:	1 กุมภาพันธ์ 2565	
	WI-RIC-OP02-34	หน้า	:	หน้า 7 จาก 13	
ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)					

## 6.3. ขั้นตอนการปรับโฟกัส

- 6.3.1.เมื่อตัวอย่างพร้อมทำการทดสอบทำการเลื่อนภาพที่หน้าจอโดยใช้ปุ่มเม้าส์กลางคลิกที่ภาพไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการโฟกัส
- 6.3.2.ทำการปรับการขยายโดยคลิกที่ Panel ด้านข้าง (Mag) ของโปรแกรมหรือกดปุ่ม M โดยปรับตั้งแต่ 500 เท่าขึ้นไป พิมพ์เลขที่ต้องการขยายที่ช่อง adjust จากนั้นกด Enter



- 6.3.3. ปรับ Working Distance (WD) คลิกที่ Panel ด้านข้าง (WD) หรือกดปุ่ม W โดยใช้ลูกกลิ้งปรับไป ทางซ้ายเป็นการลดระยะ ปัดไปทางขวาเป็นการเพิ่มระยะปรับให้ชัดพอประมาณ
- 6.3.4. ปรับ Stigmator (Stig) คลิกที่ Panel ด้านข้าง หรือกดปุ่ม S โดยใช้ลูกกลิ้งปัดไปทางซ้ายเป็นการลดใน แกน X การปรับทางขวาเป็นการเพิ่มในแกน X การปัดขึ้นเป็นการเพิ่มในแกน Y การปัดลงเป็นการลดใน แกน Y ทุกครั้งที่ปรับให้ทำการกดปุ่ม F11 ในแกน X F12 แกน Y ค้างไว้ขณะปรับโดยปรับให้ภาพชัด พอประมาณ ซึ่งโดยปกติจะปรับ Stigmator ในกรณีที่มีการปรับขยายในระดับ 10,000 เท่าขึ้นไป



	วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00	
	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	:	1 กุมภาพันธ์ 2565	
RIC KKU	WI-RIC-OP02-34	หน้า	:	หน้า 8 จาก 13	
ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)					

6.3.5. หลังจากที่ภาพชัดพอประมาณแล้วให้ทำการปรับแกน Z โดยใส่ค่า WD ที่ต้องการที่ WD&Z ที่ซ้ายล่าง ของโปรแกรม จากนั้นกด Enter โดยให้เม้าส์ชี้ที่ปุ่ม STOP ไว้ตลอดเวลาขณะที่ Stage กำลังเลื่อนเพื่อ ป้องกันการชน Window



6.3.6. เมื่อปรับแกน Z จะทำให้ภาพเบลอจึงจำเป็นต้องปรับโฟกัสใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 8.1 ถึง 8.4



## 6.4. ขั้นตอนการถ่ายภาพ

6.4.1.เมื่อได้ภาพที่ต้องการให้ทำการกดปุ่มถ่ายภาพ และบันทึกภาพไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ โดยระบุ กำลังไฟฟ้า การขยาย และโหมดการถ่ายภาพ เช่น 15Kev 500x SE.tiff เป็นต้น

	วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00	
	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	:	1 กุมภาพันธ์ 2565	
RIC KKU	WI-RIC-OP02-34	หน้า	:	หน้า 9 จาก 13	
ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)					



6.4.2.เมื่อบันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่ม Scan อีกครั้งเนื่องจากหลังจากถ่ายเสร็จแล้ว โปรแกรมจะหยุดการ Scan



# 6.5. ขั้นตอนการปรับ Wobble

เนื่องจากในกรณีที่ปรับขยายสูงจะเกิดการเคลื่อนที่ของภาพทั้งในแกน X และ Y สาเหตุมาจาก Beam ไม่เป็น ทรงกลมจึงต้องทำการปรับ Wobble โดยการคลิ๊กที่ Wobble จากนั้นปรับ Scan Speed เป็น 1 และทำการใช้ลูกกลิ้ง ปัดไปทางซ้ายเป็นการลดในแกน X การปรับทางขวาเป็นการเพิ่มในแกน X การปัดขึ้นเป็นการเพิ่มในแกน Y การปัดลง เป็นการลดในแกน Y ทุกครั้งที่ปรับให้ทำการกดปุ่ม F11 ในแกน X F12 แกน Y ค้างไว้ขณะปรับโดยปรับให้ภาพนิ่งไม่ สั่นไปทางใดทางหนึ่ง คล้ายกับการปรับ Stigmator

### 6.6. ขั้นตอนการวิเคราะห์ธาตุ (EDS)

การวิเคราะห์ธาตุเป็นการระบุสัณฐานของวัสดุหรือตำแหน่งที่สนใจ โดยจะใช้สัญญาณ X-ray จากอิเล็กตรอน ที่เข้ามาแทนที่ชั้นพลังงานที่สูงกว่า และต้องมีระยะ WD เท่ากับ 15 mm พร้อมกับปิด IR Camera มีขั้นตอนดังนี้ 6.6.1.ปรับ Energy ให้มีจำนวนเป็น 2 เท่าของชั้นพลังงานของธาตุที่สนใจ และต้องมากกว่า 20 keV จากนั้น ปรับ Beam Currrent ให้มีค่า DT ในการประมวลผล อยู่ระหว่าง 20-40% และ CPS มากกว่า 30,000

		วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00		
	RIC KKU	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	:	1 กุมภาพันธ์ 2565		
		WI-RIC-OP02-34	หน้า		หน้า 10 จาก 13		
	ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)						



6.6.2.ปรับโฟกัสตามข้อที่ 8.

- 6.6.3.เปิด EDS เพิ่ม Sample เลือกโหมดการวิเคราะห์ธาตุที่ต้องการได้แก่ Point, Spectrum, Line และ Mapping และเลือกพื้นที่ที่ต้องการวิเคราะห์หากต้องการวิเคราะห์ทั้งหน้าจอไม่ต้องเลือกพื้นที่ เลือก เกณฑ์การหยุดวิเคราะห์เป็น Quality และกดเริ่มวิเคราะห์
- 6.6.4.เมื่อวิเคราะห์เสร็จกดบันทึก Save all และ Save Report

#### 6.7. การปิดเครื่อง

6.7.1.คลิกที่ Sleep เลือก Power save mode ปั้มจะหยุดทำงาน



		วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00		
	RIC KKU	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	:	1 กุมภาพันธ์ 2565		
		WI-RIC-OP02-34	หน้า	:	หน้า 11 จาก 13		
	ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)						



6.7.2.ปิดวาล์วที่ถังไนโตรเจนเพื่อป้องกันการ Leak



#### 7. การรายงานผลการทดสอบ

- 7.1. อัพโหลดโฟลเดอร์ข้อมูลการทดสอบของลูกค้าไว้ใน Google drive
- 7.2. ตั้งค่าการแชร์ และ copy link ส่งให้ลูกค้าทาง E-mail
- 7.3. ย้ายข้อมูลรายงานผลการทดสอบลูกค้าไปยังโฟลเดอร์เข้ารหัสเพื่อรอ Backup

#### 8. การบำรุงรักษา

8.1. การบำรุงรักษา Stage

เป็นการ calibrate stage แกน X Y และ Z โดยไปที่ Menu>Tools> Calibrate Stage จากนั้นรอประมาณ 5 นาที โดยมีความถี่เดือนละ 1 ครั้ง

8.2. การกำจัดไฟฟ้าสถิตภายใน Chamber

เป็นการลดไฟฟ้าสถิตภายใน Chamber เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนและไม่เกิดสัญญาณรบกวน โดยไปที่ Menu>Tools>Degauss โดยมีความถี่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์

8.3. การควบคุมความชื้นภายในห้อง

		วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00	
	RIC KKU	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	:	1 กุมภาพันธ์ 2565	
		WI-RIC-OP02-34	หน้า	••	หน้า 12 จาก 13	
	ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)					

ตรวจสอบความชื้นของห้องปฏิบัติการ โดยความชื้นต้องไม่เกิน 70 %RH ที่หน้าเครื่องดูดความชื้น เนื่องจาก จะส่งผลต่อตู้ควบคุมที่เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อาจจะทำให้ short circuit ได้ โดยตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งาน และบันทึกค่าความชื้น, อุณหภูมิที่อ่านได้ลงใน FM-RIC-OP02-01 แบบบันทึกการควบคุมสภาพแวดล้อม



8.4. การตรวจสอบแรงดันปั้มลม

เนื่องจากแรงดันปั๊มลมส่งผลต่อการควบคุมการสั่นสะเทือนของ Chamber และการเคลื่อนที่ทางกลภายใน Chamber ดังนั้นจึงต้องควบคุมแรงดันอย่างสม่ำเสมอโดยให้อยู่ในระดับ 6-8 Bar สังเกตจากเกจวัดแรงดันที่หน้าปั๊มลม อยู่เสมอเมื่อมีการทดสอบ และเนื่องจากปั๊มลมเป็นชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและไร้น้ำมันหล่อลื่น (oil free) จึงไม่จำเป็นต้อง บำรุงรักษาโดยการเติมน้ำมันหล่อลื่น โดยตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งานทุกครั้ง



		วิธีการปฏิบัติงาน	ครั้งที่แก้ไข	:	00		
	RIC KKU	หมายเลขเอกสาร	วันที่บังคับใช้	:	1 กุมภาพันธ์ 2565		
		WI-RIC-OP02-34	หน้า	:	หน้า 13 จาก 13		
	ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติงานกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)						

8.5. การทำความสะอาดบริเวณโต๊ะวางเครื่องมือ

เนื่องจากเป็นการป้องกันฝุ่นและน้ำมันในบริเวณ Chamber จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดโดยการใช้ แอลกอฮอล์ และผ้าชนิดไร้ขนเช็ดบริเวณโต๊ะและรอให้แห้งสนิท ความถี่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

8.6. การทำความสะอาดบริเวณห้องปฏิบัติการ

การทำความสะอาดห้องปฏิบัติการต้องทำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับงานว่ามีความสกปรกมากน้อย เพียงใด โดยจะเป็นการกวาดฝุ่นและเช็ดพื้น เพื่อป้องกันการกักเก็บฝุ่นและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น

8.7. ตรวจเช็คสภาพสายไฟภายนอก

ตรวจสอบสภาพสายไฟว่ามีการชำรุดหรือเสียหายหรือไม่ โดยสังเกตที่ปลั๊ก และสายไฟฟ้าภายใน ห้องปฏิบัติการโดยมีความถี่เดือนละ 1 ครั้ง

8.8. การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ทำการบำรุงรักษาสภาพตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยการใช้แอลกอฮอล์เซ็ดทำความ สะอาดพร้อมกับผ้าสะอาดไร้ขน และทำการ Reboot คอมพิวเตอร์ Defragment Hard disk พร้อมกับ Backup ข้อมูล การทดสอบในคอมพิวเตอร์ลงใน Google drive จากนั้นลบข้อมูลการทดสอบในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำการตรวจเซ็ค สภาพภายนอกของอุปกรณ์และปลั๊กไฟ โดยมีความถี่เดือนละ 1 ครั้ง

		ทุกครั้งที่ใช้งาน	ประจำสัปดาห์	ประจำเดือน	ประจำปี
1.	การควบคุมความชื้นภายในห้องปฏิบัติการ	$\checkmark$	$\checkmark$		
	< 70 %RH				
2.	แรงดันของปั้มลม 6-8 bar	$\checkmark$			
3.	การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ภายใน Chamber		$\checkmark$		
4.	การ Calibrate Stage			$\checkmark$	
5.	การเช็ดทำความสะอาดบริเวณโต๊ะวางเครื่องมือ			$\checkmark$	
	และการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ				
6.	ตรวจเซ็คสภาพสายไฟภายนอก			$\checkmark$	
7.	การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ			$\checkmark$	
8.	ตรวจสอบเครื่องมือประจำปี				$\checkmark$

กล่าวโดยสรุปการบำรุงเครื่องมือทั่วไป มีการกำหนดแผนการตรวจสอบและบำรุงกล้องอิเล็กตรอนแบบส่อง กราด (FE-SEM) ในเอกสารการตรวจสภาพเครื่องมือวิจัย (FM-RIC-OP01-03) ดังนี้